5

ABSTRACT OF THE DISCLOSURE

基板の測定面上の検体に対し励起光を照射し、該検体より発せられた蛍光を 測定する装置において、励起光の効率的な除去を行なう方法を提供する。

該蛍光を測定する検光部への該励起光の進入を防ぐことが可能なように、該励 起光照射部と該検光部を設置し、

該検体に対し該励起光を照射した後に、該基板の測定面上の検体を該励起光照 射部から該検光部へ相対的に移動させて該検体からの蛍光を測定することを特徴 とする蛍光測定方法。